



LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO METALOGRÁFICA E MICROSCOPIA - INTM/UFPE

Formulário para realização de preparação metalográfica e microscopia

Solicitante:

Orientador:

E-mail:

Curso/Universidade:

Data de Solicitação:

Telefone para contato:

Assinatura do Solicitante

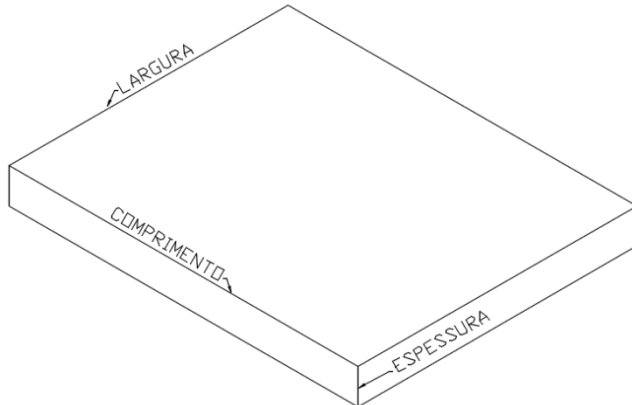
Assinatura do Orientador

FINALIDADE:

- Corte Metalográfico Grosseiro
- Corte Metalográfico Fino
- Preparação de Amostras por Metalografia Convencional
- Macrografia
- Micrografia por Microscopia Ótica
- Micrografia por MEV de bancada Hitachi (Até 3000x)
- EDS com MEV de bancada Hitachi (Até 3000x)

MATERIAL DE BASE/SUBSTRATO:

Especificação:



Largura:

Comprimento:

Espessura:

Em caso de corte metalográfico e/ou preparação de amostras por metalografia convencional, descreva brevemente o procedimento a ser empregado:

CONDIÇÕES METALOGRAFICAS:

Macrografia

Tipo de Corte:

Há necessidade de preparação de superfície? Sim Não

Há necessidade de ataque a superfície (ácido, iodo, Fry)? Sim Não

Há necessidade de preparação especial da amostra? Sim Não

Caso anterior afirmativo, descreva brevemente o procedimento especial:



Microscopia por Microscopia Ótica

Tamanho e Quantidade da Amostra:

Espécie e Natureza da Amostra:

Há necessidade de Lixamento e/ou Polimento? Sim Não

Há necessidade de Ataque e/ou Embutimento? Sim Não

Há necessidade de preparação especial da amostra? Sim Não

Caso afirmativo, em uma ou mais das três opções anteriores, descreva brevemente o procedimento a ser realizado:

CONDIÇÕES DE ANÁLISE MEV DE BANCADA:

Material:

Número de Amostras:

Estado da amostra: Sólido Pó Filme

A amostra é metálica? Sim Não

A amostra é magnética? Sim Não

A amostra foi seca sob vácuo? Sim Não

A amostra sofreu tratamento térmico e/ou químico para retirada de umidade? Sim Não

(Se sim, informar procedimento em anexo).

Quais ampliações serão necessárias (Até 3000x)?

R.:

Detectores que devem ser utilizados: BSE EDS



Em caso de utilização do EDS, quais elementos deveriam ser encontrados?

R.:

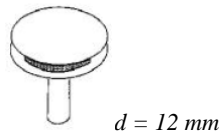


Observações Gerais

- * A operação é feita em virtude dos parâmetros e descrições de procedimentos operacionais, a falta dos mesmos pelo solicitante pode inviabilizar a realização da análise, sendo necessário ao requerente solicitar novamente uma nova análise.
- * As análises serão feitas sempre junto ao solicitante em dia e horário previamente agendados. As amostras deverão ser recolhidas em até 15 dias corridos, caso contrário serão **descartadas**.
- * Favor seguir os procedimentos padrões e boas práticas laboratoriais.
- * Os equipamentos presentes no laboratório: Cortadeira de precisão DiscoTom – 10; Cortadeira de precisão Accutom – 100; Microscópio binocular Axio Lab A1; Estéreo microscópio Stemi 2000; Microscópio eletrônico de varredura de bancada - TM3000.
- * Verificar a disponibilidade dos equipamentos antes de solicitar a análise.
- * Nos casos de cortes verificar disponibilidade dos discos.
- * Em caso de insumos/consumíveis/reagentes externos, os mesmos devem ser avaliados pelo responsável técnico antes de seu emprego/utilização.
- * Nos casos de preparações especiais (com reagentes químicos, limpeza ultrassônica, poltriz automática, entre outros) verificar disponibilidade no laboratório.
- * Não há metalização por se tratar de um MEV de bancada.
- * Para amostra(s) em pó ou que contenham pó na superfície a preparação deve ser avaliada pelo operador.
- * O modelo TM 3000 (Hitachi) opera em baixo vácuo, favor verificar disponibilidade desse modo.
- * Em caso de dúvidas e/ou ajuda processual favor entrar em contato com o Professor Responsável.

Amostra(s) para análise de MEV

- * Realizamos análises apenas uma vez por semana.
 - * Na hora da análise, fora o operador, só serão autorizados 02 usuários acompanhando a análise por causa da vibração.
 - * Métodos especiais de preparo de amostra são de responsabilidade do solicitante. Sendo necessário comprovação da preparação para usar o equipamento.
 - * Amostras com umidade não serão analisadas em hipótese alguma. Também não serão analisadas amostras embutidas.
 - * Quanto menor(es) a(s) amostra(s) melhor, já que poderemos colocar mais de uma por *stub*, otimizando o tempo de análise (dentro do MEV podem ser colocados apenas 4 *stubs*).
- É importante salientar que o stub possui 12 mm de diâmetro, logo amostras com mais de 12 mm só serão aceitas com autorização prévia do responsável técnico pelo equipamento.*



- * Quanto mais informações entregues ao operador (por meio de artigos ou imagens prévias), mais rápido será a análise assim a produção de boas imagens.
- * O solicitante, no decorrer da análise, deve estar ciente da identificação da(s) amostra(s) presente(s) no(s) *stub*(s)
- * **Na data da análise não esquecer de levar um CD/DVD para salvar os dados.**



Uso exclusivo do Operador:

Operador:

Data:

Total de horas de análise: _____ h